

# ТЕОРЕТИЧНА І ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”  
“Фізико-математичні науки”  
Вип.696 № 696, (2011) с. 116–126

JOURNAL OF NATIONAL UNIVERSITY  
“LVIVSKA POLITECHNIKA”  
“Physical & mathematical sciences”  
Vol.696 No 696, (2011) 116–126

## ПОПЕРЕЧНІ СТАТИЧНІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ, П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНІ І ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКІВ СІМ’Ї $\text{KH}_2\text{PO}_4$

Р.Р. Левицький<sup>a</sup>, А.С. Вдович<sup>a</sup>, І.Р. Зачек<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Інститут фізики конденсованих систем НАН України  
вул. Свєнціцького 1, 790011, Львів, Україна

<sup>b</sup>Національний університет “Львівська політехніка”  
вул. С. Бандери 12, 79013, Львів, Україна

(Отримано 4 березня 2011 р.)

У межах модифікованої моделі протонного впорядкування з врахуванням лінійних за деформаціями  $\varepsilon_6$  і  $\varepsilon_4$  внесків в енергію протонної системи в наближенні чотиричастинкового кластера отримано термодинамічний потенціал і на його основі розраховано поперечні статичні діелектричні, п’єзоелектричні та пружні характеристики сегнетоелектриків типу  $\text{KD}_2\text{PO}_4$ . Проведено грунтовний числовий аналіз отриманих результатів, знайдено оптимальні набори мікропараметрів, які забезпечують добрий кількісний опис відповідних експериментальних даних для сегнетоелектриків  $\text{M}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$  ( $\text{M} = \text{K}, \text{Rb}$ ,  $\text{X} = \text{P}, \text{As}$ ).

**Ключові слова:** сегнетоелектрики, діелектрична проникність, п’єзоелектричні константи.

**PACS:** 77.84.-s, 77.22.-d, 77.80.-e, 77.80.Bh, 77.65.Bn

**УДК:** 526.7

### I. Вступ

Сегнетоелектрики  $\text{MD}_2\text{XO}_4$  ( $\text{M} = \text{K}, \text{Rb}$ ,  $\text{X} = \text{P}, \text{As}$ ) у параелектричній фазі кристалізуються в класі  $\bar{4} \cdot m$  тетрагональної сингонії (просторова група  $I\bar{4}2d$  з нецентральною точковою групою  $D_{2d}$ ). Ці кристали в обох фазах мають п’єзоелектричні властивості, що істотно впливає на поведінку їхніх фізичних характеристик. Важливим є також і те, що в цих кристалах при сегнетоелектричному фазовому переході виникає спонтанна деформація  $\varepsilon_6 = \varepsilon_{xy}$ , яка приводить до зміни їхньої симетрії. На жаль, цій проблемі тривалий час не було приділено належної уваги. Описуючи діелектричні властивості сегнетоелектриків типу  $\text{MD}_2\text{XO}_4$  на основі звичайної протонної моделі (див. [1–4]), обмежувалися статичною границею та високочастотною релаксацією. Питання про дослідження п’єзоелектричного резонансу в моделі, що не враховує п’єзоefекту, не мало змісту взагалі. Потрібно також відзначити, що якісно правильні результати для високочастотних діелектричних характеристик сполук типу  $\text{MD}_2\text{XO}_4$  можна отримати лише з врахуванням п’єзоелектричної взаємодії. Класична же протонна модель не дозволяє описати ефекти, пов’язані з різницею у режимах вільного і затиснутого кристала і явище затискання кристала високочастотним полем. Це, зокрема, приводить до некоректного опису температурної поведінки розрахованого часу релаксації поляризації та динамічної діелектричної проникності сегнетоелектриків типу  $\text{MD}_2\text{XO}_4$  в області фазового переходу.

У разі прикладання електричних полів і зсувних напруг певної симетрії є можливість вивчати значення п’єзоелектричних взаємодій у фазовому переході та їхній вплив на фізичні характеристики цих кристалів.

Дослідження впливу п’єзоелектричної взаємодії на фазовий переход та деякі фізичні характеристики сегнетоелектриків типу  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  було започатковано в роботі [5], в якій модифіковано теорію Слєтера [6], враховуючи розщеплення найнижчого сегнетоелектричного рівня протонної системи, яке зумовлене деформацією  $\varepsilon_6$ . Фундаментальні результати для деформованих сегнетоактивних сполук типу  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  були отримані в роботах [7–13]. До того ж автори робіт [7, 8] вперше модифікували модель протонного впорядкування для цих кристалів, враховуючи лінійний за деформацією  $\varepsilon_6$  внесок в енергію протонної системи. Отриманий у цих роботах гамільтоніан містить деформаційне молекулярне поле і враховує лише розщеплення енергій бічних протонних конфігурацій. Пізніше в роботах [9–12] було враховано всі можливі розщеплення енергій протонних конфігурацій, які зумовлені деформацією  $\varepsilon_6$ . У роботах [9, 10] вперше досліджено фазовий переход у деформованих кристалах  $\text{MD}_2\text{XO}_4$  і розраховано їхні термодинамічні та поздовжні діелектричні, п’єзоелектричні і пружні характеристики і вивчено вплив на них напруги  $\sigma_6$  в кристалі  $\text{K}(\text{H}_{0,12}\text{D}_{0,88})_2\text{PO}_4$ . Дослідження термодинамічних, поздовжніх та поперечних діелектричних, п’єзоелектричних та пружніх

характеристик сегнетоелектриків  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  із врахуванням тунелювання виконано в роботах [11, 12]. Отримано добрий кількісний опис за запропонованою теорією наявних експериментальних даних для сегнетоелектриків  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  та антисегнетоелектриків  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$  в парафазі. Варто відзначити також роботу [14], в якій досліджувався механізм виникнення спонтанної деформації  $\varepsilon_6$  у сегнетоелектриках типу  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  і вплив на неї взаємодії протонів з акустичними коливаннями гратки.

Актуальними, враховуючи наявність експериментальних даних для поперечних діелектричних, п'єзоелектрических та пружних характеристик кристалів сім'ї  $\text{MD}_2\text{XO}_4$ , які необхідно описати теоретично, є і дослідження фізичних характеристик цих кристалів під час прикладання до них поперечних зовнішніх електрических полів  $E_1$  або  $E_2$  та зсувних напруг  $\sigma_4 = \sigma_{yz}$  і  $\sigma_5 = \sigma_{xz}$ , які незалежно індукують відповідні внески в поляризації  $P_1$  і  $P_2$  та деформації  $\varepsilon_4$  і  $\varepsilon_5$  цих кристалів із врахуванням наявності в них спонтанної деформації  $\varepsilon_6$ . Відзначимо, що в переважній більшості робіт [15–22], присвячених дослідженню поперечних діелектрических характеристик кристалів  $\text{M}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$ , п'єзоелектричні взаємодії не враховувались. У роботі [13] для сегнетоелектриків типу  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  запропоновано узагальнення протонної моделі з тунелюванням для дослідження п'єзоелектрических, діелектрических та пружних властивостей, що пов'язані із деформаціями  $\varepsilon_4$  та  $\varepsilon_5$ . Отримано в наближенні чотиричастинкового кластера вирази для поперечних фізических характеристик цих кристалів у параелектричній фазі. Досягнуто належним вибором параметрів теорії доброго узгодження теоретичних та експериментальних результатів для сегнетоелектрика  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  і антисегнетоелектрика  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ .

Зауважимо, що в роботах [9–13] не вивчались динамічні властивості сегнетоелектриків типу  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  із врахуванням п'єзоелектрическої взаємодії. Однак такі дослідження є дуже важливими. У зв'язку із встановленням у роботі [23] ефектом пригнічення тунелювання в сегнетоелектриках типу  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  та принциповими труднощами, які виникають під час розрахунків динамічних характеристик цих кристалів із врахуванням тунелювання, цю задачу доцільно розв'язувати, нехтуючи тунелюванням. У роботах [24, 25] у межах модифікованих протонних моделей вивчались релаксаційні явища в кристалах  $\text{MD}_2\text{XO}_4$  та було розраховано для них коефіцієнти поглинання та швидкості ультразвуку. Було явно описано явища затискання кристала високочастотним електричним полем, п'єзоелектричного резонансу і НВЧ дисперсії, що спостерігається на експерименті.

Ця робота присвячена вивченю в межах модифікованої протонної моделі поперечних статичних діелектрических, п'єзоелектрических і пружних характеристик сегнетоелектриків  $\text{M}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$  без тунелювання в пара- і сегнетоелектричній фазах, що пов'язані з деформацією  $\varepsilon_4$ .

## II. Гамільтоніан кристала

Розглянемо систему дейtronів, які рухаються на О-Д...О зв'язках в діелектрических сегнетоелектрических ортофосфатах (ДСОФ). Примітивна комірка гратки Браве ДСОФ складається з двох тетраедрів  $\text{PO}_4$  разом з чотирма водневими зв'язками, що належать до одного з них (тетраедра типу "A"); водневі зв'язки, які підходять до другого тетраедра (типу "B"), належать чотирьом найближчим структурним елементам, які його оточують (рис.1). Тут ①, ②, ③ і ④ – водневі зв'язки, 1, 2 – положення дейtronів на цих зв'язках.

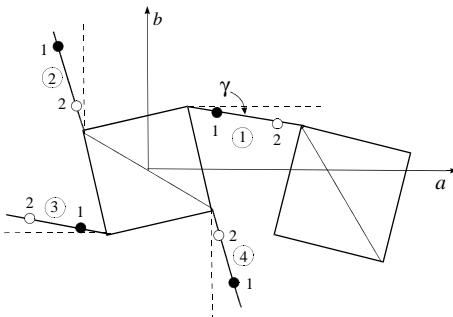


Рис. 1. Примітивна комірка Браве KDP. Цифри ①, ②, ③, ④ нумерують водневі зв'язки, а 1, 2 – можливі положення протонів на зв'язках. Показано одну з числа можливих протонних конфігурацій

Гамільтоніан дейtronної системи ДСОФ з врахуванням короткосвіжих і далекосвіжих взаємодій у разі прикладання до кристала механічної напруги  $\sigma_4 = \sigma_{yz}$  та зовнішнього поля  $E_1$ , направленого вздовж кристалографічної осі  $a$ , складається із "затравочної" та псевдоспінової частин:

$$\hat{H} = NH^0 + \hat{H}_s. \quad (2.1)$$

де  $N$  – загальна кількість примітивних комірок. "Затравочна" частина енергії примітивної комірки, яка виражається через деформації  $\varepsilon_j$  ( $j = 4, 6$ ) і електричне поле  $E_1$ , включає в себе пружну, п'єзоелектричну та діелектричну складові:

$$H^0 = \frac{v}{2}(c_{44}^{E0}\varepsilon_4^2 + c_{66}^{E0}\varepsilon_6^2) - ve_{14}^0\varepsilon_4 E_1 - \frac{v}{2}\chi_{11}^{\varepsilon_0}E_1^2 \quad (2.2)$$

Перші два доданки в правій частині (2.2) – пружна енергія, яка не залежить від розміщення дейtronів на водневих зв'язках ( $c_{66}^{E0}$ ,  $c_{44}^{E0}$  – "затравочні" пружні сталі); третій – енергія взаємодії між поляризацією, що виникає за рахунок п'єзоелектричного ефекту під час деформації  $\varepsilon_4$  без врахування водневих зв'язків і полем  $E_1$  ( $e_{14}^0$  – "затравочний" коефіцієнт п'єзоелектрическої напруги); четвертий доданок відповідає енергії, яка обумовлена поляризацією, що індукована зовнішнім електрическим полем незалежно від конфігурацій дейtronів на водневих зв'язках ( $\chi_{11}^{\varepsilon_0}$  – "затравочна" діелектрична сприйнятливість),  $v$  – об'єм примітивної комірки.

Псевдоспінова частина гамільтоніану має вигляд

$$\hat{H}_s = \frac{1}{2} \sum_{\substack{qf \\ q'f'}} J_{ff'}(qq') \frac{\langle \sigma_{qf} \rangle}{2} \frac{\langle \sigma_{q'f'} \rangle}{2} - \sum_{qf} 2\mu F_f \frac{\sigma_{qf}}{2} + \hat{H}_{sh}(4) - \sum_{qf} \mu_{f1} E_1 \frac{\sigma_{qf}}{2}. \quad (2.3)$$

Перші два доданки в (2.3) – гамільтоніан середнього поля за далекосяжними диполь-дипольними взаємодіями і непрямими через коливання гратки між дейtronами взаємодіями та середнього поля, індукованого п’єзоелектричною взаємодією, причому

$$\begin{aligned} \mu F_3 &= \nu_1 \eta_1^{(1)} + \nu_3 \eta_3^{(1)} + \nu_2 \eta_2^{(1)} + \nu_4 \eta_4^{(1)} - \psi_6 \varepsilon_6 \pm \psi_4 \varepsilon_4, \\ \mu F_4 &= \nu_2 \eta_1^{(1)} + \nu_3 \eta_3^{(1)} + \nu_1 \eta_2^{(1)} + \nu_4 \eta_4^{(1)} - \psi_6 \varepsilon_6, \end{aligned}$$

де  $\eta_f^{(1)} = \langle \sigma_{qf} \rangle$  – середнє значення ізінгівського псевдоспіна  $\sigma_{qf} = \pm 1$ , два власні значення якого відповідають двом рівноважним положенням дейtronона в  $q$ -ї комірці на  $f$ -му водневому зв’язку;

$$\nu_1 = \frac{J_{11}}{4}, \quad \nu_2 = \frac{J_{12}}{4}, \quad \nu_3 = \frac{J_{13}}{4},$$

а  $J_{ff'} = \sum_{R_q - R_{q'}} J_{ff'}(qq')$  – Фур’є-образ константи далекосяжних взаємодій між дейtronами;  $\psi_4, \psi_6$  – т.

зв. деформаційні потенціали.  $\hat{H}_{sh}(4)$  – гамільтоніан короткосяжних конфігураційних взаємодій між дейtronами поблизу тетраедрів  $\text{PO}_4$ . Враховуючи значення енергій дейtronів, які оточують тетраедр  $\text{PO}_4$ , за наявності спонтанної деформації  $\varepsilon_6$ , і деформації  $\varepsilon_4$  (табл.1) [13], можна записати гамільтоніан короткосяжних взаємодій у наближенні чотиричастинкового кластера в такому вигляді [2]:

$$\hat{H}_{sh}(4) = \sum_q [\hat{H}_4^A(q) + \hat{H}_4^B(q)].$$

Тут  $\hat{H}_4^{A,B}(q)$  – гамільтоніан конфігураційних взаємодій дейtronів біля тетраедрів  $\text{PO}_4$  типу “А” і типу “В”. До того ж

$$\hat{H}_4^A(q) = \sum_{i=1}^{16} \hat{N}_i^A(q) E_i(4),$$

де  $\hat{N}_i(q) = \prod_{f=1}^4 \frac{1}{2} (1 + s_f \frac{\hat{\sigma}_{qf}}{2})$  – оператор чотиричастинкової конфігурації  $s_1 s_2 s_3 s_4$  [2, 28], в якому  $s_f$  відповідає власне значення оператора  $\hat{\sigma}_{qf}$  у конкретній конфігурації дейtronів,  $s_f = \pm 1$ ,  $E_i(4)$  – енергії конфігурацій дейtronів (табл. 1).

Таблиця 1

### Енергії конфігурацій дейtronів поблизу тетраедра $\text{PO}_4$

$i$		$\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4$	$E_i$	$i$		$\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4$	$E_i$
1		+++	$\varepsilon_s - \delta_{s6} \varepsilon_6$	9		- - - +	$\varepsilon_1 - \delta_{16} \varepsilon_6 - \delta_{15} \varepsilon_5$
2		- - - -	$\varepsilon_s + \delta_{s6} \varepsilon_6$	10		- - + -	$\varepsilon_1 - \delta_{16} \varepsilon_6 + \delta_{14} \varepsilon_4$
3		+ - + -	$\varepsilon_0$	11		- + - -	$\varepsilon_1 - \delta_{16} \varepsilon_6 + \delta_{15} \varepsilon_5$
4		- + - +		12		+ - - -	$\varepsilon_1 - \delta_{16} \varepsilon_6 - \delta_{14} \varepsilon_4$
5		+ + - -	$\varepsilon_a + \delta_{a6} \varepsilon_6 - \delta_{a4} \varepsilon_4 + \delta_{a5} \varepsilon_5$	13		+ + - +	$\varepsilon_1 + \delta_{16} \varepsilon_6 - \delta_{14} \varepsilon_4$
6		- - + +	$\varepsilon_a + \delta_{a6} \varepsilon_6 + \delta_{a4} \varepsilon_4 - \delta_{a5} \varepsilon_5$	14		+ + + -	$\varepsilon_1 + \delta_{16} \varepsilon_6 + \delta_{15} \varepsilon_5$
7		- + + -	$\varepsilon_a - \delta_{a6} \varepsilon_6 + \delta_{a4} \varepsilon_4 + \delta_{a5} \varepsilon_5$	15		- + ++	$\varepsilon_1 + \delta_{16} \varepsilon_6 + \delta_{14} \varepsilon_4$
8		+ - - +	$\varepsilon_a - \delta_{a6} \varepsilon_6 - \delta_{a4} \varepsilon_4 - \delta_{a5} \varepsilon_5$	16		+ - ++	$\varepsilon_1 + \delta_{16} \varepsilon_6 - \delta_{15} \varepsilon_5$

Внески в конфігураційну енергію примітивної комірки є однаковими для обох тетраедрів [2, 29]. У результаті, гамільтоніан  $\hat{H}_{sh}(4)$  подамо в такому вигляді:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{sh}(4) = & \\ = & \sum_q \left\{ -\frac{1}{4}(\delta_{s6}\varepsilon_6 - 2\delta_{16}\varepsilon_6) \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} + \frac{\sigma_{q2}}{2} + \frac{\sigma_{q3}}{2} + \frac{\sigma_{q4}}{2} \right) + \right. \\ & -\frac{1}{2}(\delta_{a4}\varepsilon_4 + \delta_{14}\varepsilon_4) \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} - \frac{\sigma_{q3}}{2} \right) - \\ & +(-\delta_{s6}\varepsilon_6 - 2\delta_{16}\varepsilon_6) \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} + \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} + \right. \\ & +\frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} + \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} \Big) + \\ & +2(\delta_{a4}\varepsilon_4 - \delta_{14}\varepsilon_4) \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} - \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} \right) + \quad (4) \\ & +(V + \delta_{a6}\varepsilon_6) \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} + \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} \right) + \\ & +(V - \delta_{a6}\varepsilon_6) \left( \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} + \frac{\sigma_{q4}}{2} \frac{\sigma_{q1}}{2} \right) + \\ & \left. +U \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} + \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} \right) + \Phi \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} \right\}. \end{aligned}$$

Тут

$$V = -\frac{1}{2}w_1, \quad U = \frac{1}{2}w_1 - \varepsilon, \quad \Phi = 4\varepsilon - 8w + 2w_1,$$

а

$$\varepsilon = \varepsilon_a - \varepsilon_s, \quad w = \varepsilon_1 - \varepsilon_s, \quad w_1 = \varepsilon_0 - \varepsilon_s,$$

де  $\varepsilon_s$ ,  $\varepsilon_a$ ,  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_0$  – конфігураційні енергії дейtronів біля тетраедра  $\text{PO}_4$ , а  $\varepsilon$   $w$ ,  $w_1$  – сегнетоелектричні енергії розширеної моделі Слете-Такагі [2, 28].

Четвертий доданок у (2.3) ефективно описує взаємодію дейtronів із зовнішнім електричним полем  $E_1$ . Тут  $\mu_{f1}$  – ефективний дипольний момент водневих зв'язків, які, як показано в [30], дорівнюють сумі дипольних моментів тетраедрів і водневих зв'язків, причому

$$\mu_{11} = -\mu_{31} = \mu_1 \cos \gamma, \quad \mu_{21} = -\mu_{41} = \mu_2 \sin \gamma.$$

Враховуючи специфіку кристалічної структури сегнетоелектриків  $\text{MD}_2\text{XO}_4$  для розрахунку термодинамічного потенціалу використаємо наближення чотиричастинкового кластера за короткосяжними взаємодіями [2, 28]. До того ж далекояскіні взаємодії враховуються у наближенні молекулярного поля. У кластерному наближенні термодинамічний потенціал сегнетоелектрика  $\text{MD}_2\text{XO}_4$  має такий вигляд:

$$\begin{aligned} G(4) = & NH^{(0)} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{qf \\ q'f'}} J_{ff'}(qq') \frac{\langle \sigma_{qf} \rangle}{2} \frac{\langle \sigma_{q'f'} \rangle}{2} + \\ & + \frac{1}{2} T \sum_q \sum_{f=1}^4 \ln Z_{qf4}^{(1)} - \sum_q T \ln Z_{q4}^{(4)} - Nv\sigma_4\varepsilon_4, \quad (5) \end{aligned}$$

де  $Z_{qf4}^{(1)} = Spe^{-\beta\hat{H}_{qf}^{(1)}(4)}$ ,  $Z_{q4}^{(4)} = Spe^{-\beta\hat{H}_q^{(4)}(4)}$ ,  $\beta = \frac{1}{k_B T}$  – одночастинкова і чотиричастинкова статистичні суми.

Одночастинкові та чотиричастинковий гамільтоніані дейtronів мають вигляд

$$\hat{H}_{qf}^{(1)} = \frac{\bar{x}_{fj}}{\beta} \frac{\sigma_{qf}}{2}, \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \hat{H}_q^{(4)}(4) = & (-\delta_{s6}\varepsilon_6 - 2\delta_{16}\varepsilon_6) \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} + \right. \\ & +\frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} + \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} + \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} \Big) + \\ & +2(\delta_{a4}\varepsilon_4 - \delta_{14}\varepsilon_4) \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} - \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} \right) + \quad (7) \\ & +(V + \delta_{a6}\varepsilon_6) \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} + \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} \right) + \\ & +(V - \delta_{a6}\varepsilon_6) \left( \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} + \frac{\sigma_{q4}}{2} \frac{\sigma_{q1}}{2} \right) + \\ & +U \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} + \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} \right) + \Phi \frac{\sigma_{q1}}{2} \frac{\sigma_{q2}}{2} \frac{\sigma_{q3}}{2} \frac{\sigma_{q4}}{2} - \\ & -\frac{1}{4}(\delta_{s6}\varepsilon_6 - 2\delta_{16}\varepsilon_6) \sum_{f=1}^4 \frac{\sigma_{qf}}{2} + \\ & -\frac{1}{2}(\delta_{a4}\varepsilon_4 + \delta_{14}\varepsilon_4) \left( \frac{\sigma_{q1}}{2} - \frac{\sigma_{q3}}{2} \right) - \\ & \left. -\sum_{f=1}^4 \frac{x_{fj}}{\beta} \frac{\sigma_{qf}}{2} \right), \end{aligned}$$

У (2.6) і (2.7) використані такі позначення:

$$\begin{aligned} x_3^1 = & \beta[-\Delta_4 + 2\nu_3\eta_1^{(1)} + 2\nu_3\eta_3^{(1)} + 2\nu_2\eta_2^{(1)} + 2\nu_2\eta_4^{(1)} + \\ & -2\psi_6\varepsilon_6 \pm 2\psi_4\varepsilon_4 \pm \mu_1 \cos \gamma E_1], \\ x_4^2 = & \beta[-\Delta_j + 2\nu_2\eta_1^{(1)} + 2\nu_2\eta_3^{(1)} + 2\nu_3\eta_2^{(1)} + 2\nu_3\eta_4^{(1)} + \\ & -2\psi_6\varepsilon_6 \pm \mu_2 \sin \gamma E_1]. \quad (8) \end{aligned}$$

$$\bar{x}_f = -\beta\Delta_4 + x_f,$$

де  $\Delta_4$  – ефективне поле, яке створене сусідніми поза межами кластера зв'язками.

Унарні функції розподілу дейtronів на основі (2.6) і (2.7) отримуємо в такому вигляді:

$$\begin{aligned} \eta_1^{(1)} = & \operatorname{th}\left(\frac{\bar{x}_f}{2}\right), \\ \eta_3^1 = & \frac{1}{D_4} (\operatorname{sh} A_1 + d \operatorname{sh} A_2 \pm aa_6 \operatorname{sh} A_3 \pm \frac{a}{a_6} \operatorname{sh} A_4 \pm \\ & \pm b \operatorname{sh} A_5 \mp b \operatorname{sh} A_6 + b \operatorname{sh} A_7 + b \operatorname{sh} A_8) = \frac{m_3^{(4)}}{D_4}, \quad (9) \\ \eta_4^1 = & \frac{1}{D_4} (\operatorname{sh} A_1 - d \operatorname{sh} A_2 \pm aa_6 \operatorname{sh} A_3 \mp \frac{a}{a_6} \operatorname{sh} A_4 + \\ & + b \operatorname{sh} A_5 + b \operatorname{sh} A_6 \pm b \operatorname{sh} A_7 \mp b \operatorname{sh} A_8) = \frac{m_4^{(4)}}{D_4}, \end{aligned}$$

де

$$\begin{aligned} D_4 = & \operatorname{ch} A_1 + d \operatorname{ch} A_2 + aa_6 \operatorname{ch} A_3 + \frac{a}{a_6} \operatorname{ch} A_4 + \\ & + b \operatorname{ch} A_5 + b \operatorname{ch} A_6 + b \operatorname{ch} A_7 + b \operatorname{ch} A_8, \end{aligned}$$

Тут використані такі позначення:

$$a = e^{-\beta\varepsilon}, \quad b = e^{-\beta w}, \quad d = e^{-\beta w_1}, \quad a_6 = e^{-\beta\delta_{a6}\varepsilon_6},$$

$$\begin{aligned} A_2 &= \frac{1}{2}(x_1 \pm x_2 + x_3 \pm x_4) + \beta\delta_{s6}\varepsilon_6 \pm \beta\delta_{s6}\varepsilon_6, \\ A_3 &= \frac{1}{2}(x_1 \pm x_2 - x_3 \mp x_4) + \beta\delta_{a4}\varepsilon_4, \\ A_5 &= \frac{1}{2}(\pm x_1 + x_2 \mp x_3 + x_4) - \beta\delta_{16}\varepsilon_6 \pm \beta\delta_{14}\varepsilon_4, \\ A_7 &= \frac{1}{2}(x_1 \pm x_2 + x_3 \mp x_4) - \beta\delta_{16}\varepsilon_6. \end{aligned}$$

У кластерному наближенні [2, 28] параметр  $\Delta_4$  визначається з умови самоузгодження: середнє значення квазіспіна  $\eta_f^{(1)}(i)$  не повинно залежати від того, по якому розподілу Гіббса (з чотири- чи одночастинковим гамільтоніаном) воно розраховане.

Вилучаючи параметр  $\Delta_4$ , використовуючи (2.9), отримаємо:

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \eta_3^{(1)}}{1 - \eta_3^{(1)}} + \beta\nu_3 \eta_1^{(1)} + \beta\nu_1 \eta_3^{(1)} + \\ &+ \beta\nu_2 [\eta_2^{(1)} + \eta_4^{(1)}] - \beta\psi_6 \varepsilon_6 \pm \beta\psi_4 \varepsilon_4 \pm \frac{\beta\mu_1}{2} \cos \gamma E_1, \\ x_4 &= \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \eta_4^{(1)}}{1 - \eta_4^{(1)}} + \beta\nu_2 [\eta_1^{(1)} + \eta_3^{(1)}] + \beta\nu_3 \eta_2^{(1)} + (10) \\ &+ \beta\nu_1 \eta_4^{(1)} - \beta\psi_6 \varepsilon_6 \pm \frac{\beta\mu_2}{2} \sin \gamma E_1. \end{aligned}$$

Якщо до кристала не прикладені зовнішні електричні поля і напруги, то

$$\begin{aligned} \eta^{(1)} &= \eta_1^{(1)} = \eta_2^{(1)} = \eta_3^{(1)} = \eta_4^{(1)} = \\ &= \frac{\operatorname{sh}(2x + \beta\delta_{s6}\varepsilon_6) + 2b\operatorname{sh}(x - \beta\delta_{16}\varepsilon_6)}{\operatorname{ch}(2x + \beta\delta_{s6}\varepsilon_6) + 4b\operatorname{ch}(x - \beta\delta_{16}\varepsilon_6) + 2a + d} = \frac{m}{D}, \end{aligned}$$

а

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \eta^{(1)}}{1 - \eta^{(1)}} + \beta\nu_c \eta^{(1)} - \beta\psi_6 \varepsilon_6, \\ \nu_c &= \nu_1 + 2\nu_2 + \nu_3. \end{aligned} \quad (11)$$

### III. Поперечні діелектричні, п'єзоелектричні і пружні характеристики ДСОФ

Розрахувавши власні значення одно- і чотиричастинкового гамільтоніанів, отримуємо одно- і чотиричастинкові статистичні суми і знаходимо термодинамічний потенціал у розрахунку на примітивну комірку в такому вигляді:

$$\begin{aligned} g(4) &= \frac{\bar{v}}{2} (c_{66}^{E0} \varepsilon_6^2 + c_{44}^{E0} \varepsilon_4^2) - \bar{v} e_{14}^0 \varepsilon_4 E_1 - \frac{\bar{v}}{2} \chi_{11}^0 E_1^2 + \\ &+ 2T \ln 2 + \frac{1}{2} \nu_1 [\eta_1^{(1)2} + \eta_3^{(1)2} + \eta_2^{(1)2} + \eta_4^{(1)2}] + \\ &+ \nu_3 [\eta_1^{(1)} \eta_3^{(1)} + \eta_2^{(1)} \eta_4^{(1)}] + \\ &+ \nu_2 [\eta_1^{(1)} \eta_2^{(1)} + \eta_2^{(1)} \eta_3^{(1)} + \eta_3^{(1)} \eta_4^{(1)} + \eta_4^{(1)} \eta_1^{(1)}] - \\ &- \frac{1}{2} T \ln [1 - \eta_1^{(1)2}] - \frac{1}{2} T \ln [1 - \eta_2^{(1)2}] - \\ &- \frac{1}{2} T \ln [1 - \eta_3^{(1)2}] - \frac{1}{2} T \ln [1 - \eta_4^{(1)2}] - \\ &- 2T \ln D_4 - \bar{v} \sigma_4 \varepsilon_4, \end{aligned} \quad (3.1)$$

де  $\bar{v} = \frac{v}{k_B}$ ,  $k_B$  – стала Больцмана,

З умов термодинамічної рівноваги

$$\begin{aligned} \frac{1}{\bar{v}} \left( \frac{\partial g(4)}{\partial \varepsilon_4} \right)_{E_1, \sigma_4} &= 0, \quad \frac{1}{\bar{v}} \left( \frac{\partial g(4)}{\partial \varepsilon_6} \right)_{E_1} = 0, \\ \frac{1}{\bar{v}} \left( \frac{\partial g(4)}{\partial E_1} \right)_{\sigma_4} &= -P_1 \end{aligned}$$

отримуємо

$$\begin{aligned} \sigma_4 &= c_{44}^{E0} \varepsilon_4 - e_{14}^0 E_1 - \frac{2\psi_4}{v} \frac{1}{2} (\eta_1^{(1)} - \eta_3^{(1)}) - \\ &- \frac{2\delta_{a4}}{v D_4} \varkappa_{s1}^a - \frac{2\delta_{14}}{v D_4} \varkappa_{s2}^b, \end{aligned} \quad (3.2)$$

$$\begin{aligned} 0 &= c_{66}^{E0} \varepsilon_6 + \frac{2\psi_6}{v D_4} (2\varkappa_{s1} + \varkappa_{s1}^b + \varkappa_{s3}^b) + \\ &+ \frac{2\delta_{a6}}{v D_4} \varkappa_{c2}^a - \frac{2\delta_{s6}}{v D_4} \varkappa_{s1} + \frac{2\delta_{16}}{v D_4} (\varkappa_{s1}^b + \varkappa_{s3}^b), \\ P_1 &= e_{14}^0 \varepsilon_4 + \chi_{11}^0 E_1 + \frac{2\mu_1 \cos \gamma}{v} \frac{1}{2} (\eta_1^{(1)} - \eta_3^{(1)}) + \\ &+ \frac{2\mu_2 \sin \gamma}{v} \frac{1}{2} (\eta_2^{(1)} - \eta_4^{(1)}), \end{aligned} \quad (3.3)$$

де використані такі позначення:

$$\begin{aligned} \varkappa_{s1}^a &= aa_6 \operatorname{sh} A_3 \pm \frac{a}{a_6} \operatorname{sh} A_4, \quad \varkappa_{s2}^b = b(\operatorname{sh} A_5 \pm \operatorname{sh} A_6), \\ \varkappa_{c2}^a &= aa_6 \operatorname{ch} A_3 - \frac{a}{a_6} \operatorname{ch} A_4, \quad \varkappa_{s3}^b = b(\operatorname{sh} A_7 \pm \operatorname{sh} A_8), \\ \varkappa_{s1} &= \operatorname{sh} A_1. \end{aligned}$$

Використовуючи співвідношення (3.2) і (3.3), можна отримати вирази для поперечних п'єзоелектричних, статичних діелектричних і пружних характеристик ДСОФ.

Ізотермічний коефіцієнт п'єзоелектричної напруги недеформованого кристала отриманий у такому вигляді:

$$\begin{aligned} e_{14}^T &= - \left( \frac{\partial \sigma_4}{\partial E_1} \right)_{\varepsilon_4} = e_{14}^0 + \\ &+ \beta \frac{\mu_1 \cos \gamma + \mu_2 \sin \gamma}{v} \frac{\psi_4 (aa_6 + \varkappa^b) - \delta_{a4} aa_6 - \delta_{14} \varkappa^b}{D - 2(aa_6 + \varkappa^b) \varphi_a^\eta} + \\ &+ \beta \frac{\mu_1 \cos \gamma - \mu_2 \sin \gamma}{v} \frac{\psi_4 (\frac{a}{a_6} + \varkappa^b) - \delta_{a4} \frac{a}{a_6} - \delta_{14} \varkappa^b}{D - 2(\frac{a}{a_6} + \varkappa^b) \varphi_a^\eta}, \end{aligned} \quad (3.4)$$

де використані такі позначення:

$$\begin{aligned} \varkappa &= \varkappa_1^a + 2\varkappa^b = aa_6 + \frac{a}{a_6} + 2b \operatorname{ch}(x - \beta\delta_{16}\varepsilon_6), \\ \varphi_a^\eta &= \frac{1}{1 - \eta^{(1)2}} + \beta\nu_a \quad \nu_a = \nu_1 - \nu_3. \end{aligned}$$

Ізотермічні статичні поперечні діелектричні сприйнятливості недеформованого затиснутого кристала мають такий вигляд:

$$\begin{aligned} \chi_{11}^{\varepsilon T} &= - \left( \frac{\partial P_1}{\partial E_1} \right)_{\varepsilon_4} = \chi_{11}^{\varepsilon 0} + \\ &+ \frac{(\mu_1 \cos \gamma + \mu_2 \sin \gamma)^2}{v} \frac{\beta}{2} \frac{aa_6 + \varkappa^b}{D - 2(aa_6 + \varkappa^b) \varphi_a^\eta} + \\ &+ \frac{(\mu_1 \cos \gamma - \mu_2 \sin \gamma)^2}{v} \frac{\beta}{2} \frac{\frac{a}{a_6} + \varkappa^b}{D - 2(\frac{a}{a_6} + \varkappa^b) \varphi_a^\eta}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

Ізотермічна стала п'єзоелектричної напруги

$$h_{14}^T = - \left( \frac{\partial E_1}{\partial \varepsilon_4} \right)_{T, P_1} = \frac{e_{14}^T}{\chi_{11}^{\varepsilon T}}. \quad (3.6)$$

Розрахуємо тепер внесок у пружну сталу, зумовлений впорядкуванням дейtronів за наявності механічної напруги  $\sigma_4$ . З (3.2) отримуємо вираз для ізотермічної пружної сталі  $c_{44}^E$ :

$$\begin{aligned} c_{44}^{ET} &= \left( \frac{\partial \sigma_4}{\partial \varepsilon_4} \right)_E = c_{44}^{E0} - \\ &- \frac{2\psi_4}{v} \beta \left[ \frac{\psi_4(aa_6 + \varkappa^b) - \delta_{a4}aa_6 - \delta_{14}\varkappa^b}{D - 2(aa_6 + \varkappa^b)\varphi_a^\eta} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\psi_4(\frac{a}{a_6} + \varkappa^b) - \delta_{a4}\frac{a}{a_6} - \delta_{14}\varkappa^b}{D - 2(\frac{a}{a_6} + \varkappa^b)\varphi_a^\eta} \right] + \\ &+ \frac{4\varphi_a^\eta}{vD} \beta (\delta_{a4}aa_6 + \delta_{14}\varkappa^b) \frac{\psi_4(aa_6 + \varkappa^b) - \delta_{a4}aa_6 - \delta_{14}\varkappa^b}{D - 2(aa_6 + \varkappa^b)\varphi_a^\eta} + \\ &+ \frac{4\varphi_a^\eta}{vD} \beta (\delta_{a4}\frac{a}{a_6} + \delta_{14}\varkappa^b) \frac{\psi_4(\frac{a}{a_6} + \varkappa^b) - \delta_{a4}aa_6 - \delta_{14}\varkappa^b}{D - 2(\frac{a}{a_6} + \varkappa^b)\varphi_a^\eta} + \\ &+ \frac{2\psi_4}{vD} \beta (\delta_{a4}\varkappa_1^a + \delta_{14}\varkappa^b) - \frac{2}{vD} \beta (\delta_{a4}^2\varkappa_1^a + \delta_{14}^2\varkappa^b). \end{aligned} \quad (3.7)$$

Підставляючи вираз для поля  $E_1$ , отриманий із рівняння для поляризації  $P_1$ , у співвідношення  $\sigma_4(\varepsilon_4, E_1)$  (3.2), одержуємо вираз для напруги  $\sigma_4(\varepsilon_4, P_1)$ , на основі якої можна розрахувати пружну сталу при  $P_1 = \text{const}$ . В результаті,

$$c_{44}^{PT} = c_{44}^{ET} + e_{14}^T h_{14}^T. \quad (3.8)$$

Отже, вирази (3.2), (3.3) можна записати в такому вигляді:

$$\sigma_4 = c_{44}^{ET} \varepsilon_4 - e_{14}^T E_1, \quad P_1 = e_{14}^T \varepsilon_4 + \chi_{11}^{\varepsilon T} E_1, \quad (3.9)$$

$$\sigma_4 = c_{44}^{PT} \varepsilon_4 - h_{14}^T P_1, \quad E_1 = -h_{14}^T \varepsilon_4 + k_{11}^{\varepsilon T} P_1. \quad (3.10)$$

Отримані співвідношення є рівняннями п'єзоefекту і співпадають із рівняннями, які отримані феноменологічно [34]. Але коефіцієнти в (3.2), (3.3) отримані на основі мікроскопічної теорії.

На основі систем рівнянь (3.10) і (3.11) можна розрахувати: ізотермічний коефіцієнт п'єзоелектричної деформації

$$d_{14}^T = \left( \frac{\partial P_1}{\partial \sigma_4} \right)_{E_1} = \frac{e_{14}^T}{c_{44}^{ET}}, \quad (3.11)$$

ізотермічну сталу п'єзоелектричної деформації

$$g_{14}^T = - \left( \frac{\partial E_1}{\partial \sigma_4} \right)_{P_1} = \frac{e_{14}^T}{c_{44}^{ET} \chi_{11}^{\varepsilon T} - e_{14}^{T2}}; \quad (3.12)$$

ізотермічну статичну діелектричну сприйнятливість при  $\sigma_4 = \text{const}$

$$\chi_{11}^{\sigma T} = \left( \frac{\partial P_1}{\partial E_1} \right)_{\sigma_4} = \chi_{11}^{\varepsilon T} + e_{14}^T d_{14}^T. \quad (3.13)$$

Отже, ми отримали мікроскопічні вирази для  $e_{14}^T$ ,  $\chi_{11}^{\varepsilon T}$  і  $c_{44}^{ET}$ , а всі інші характеристики виражуються через них.

#### IV. Порівняння результатів числових розрахунків з експериментальними даними. Обговорення отриманих результатів

Тепер проаналізуємо результати числових розрахунків, отриманих в межах запропонованої моделі поперечних діелектричних, п'єзоелектричних і пружних характеристик кристалів типу  $\text{KD}_2\text{PO}_4$  і порівняємо їх з відповідними експериментальними даними для цих сполук. Вважатимемо [26, 27], що розвинена нами теорія справедлива і для  $\text{M}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$  з усередненими ефективними мікропараметрами. Підставою для цього є істотне пригнічення тунелювання короткосяжними кореляціями [23].

Для числових розрахунків температурних залежностей фізичних характеристик кристалів  $\text{M}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$ , які отримані в попередніх розділах, необхідно знайти значення ефективних параметрів. Величини енергії дейtronів конфігурацій  $\varepsilon(x)$ ,  $w(x)$ , енергії далекосяжної взаємодії  $\nu_c(x)$  і деформаційних потенціалів  $\psi_6(x)$ ,  $\delta_{s6}(x)$ ,  $\delta_{a6}(x)$  і  $\delta_{16}(x)$  вибираємо такими, як і під час розгляду відповідних поズовжніх характеристик кристалів  $\text{M}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$  [26].

Під час розрахунку поперечних характеристик потрібно визначити ще такі ефективні параметри:

- енергію далекосяжної взаємодії  $\nu_a$ ,
- деформаційні потенціали  $\psi_4$ ,  $\delta_{a4}$ ,  $\delta_{14}$ ,
- ефективний дипольний момент  $\mu_1$ ,
- “затравочну” діелектричну сприйнятливість  $\chi_{11}^{E0}$ ,
- “затравочну” пружну сталу  $c_{44}^{E0}$ ,
- “затравочний” коефіцієнт п'єзоелектричної напруги  $e_{14}^0$ .

Вважаємо [27], що кристалам  $\text{M}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$  з різними значеннями  $x$  відповідають усереднені ефективні параметри, наприклад,

$$\nu_a(x) = \nu_{aH}(1 - x) + \nu_{aD}(x),$$

$$\mu_1(x) = \mu_{1H}(1 - x) + \mu_{1D}(x).$$

Для визначення оптимальних параметрів теорії ми використали температурні залежності фізичних характеристик кристалів  $\text{M}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$ , які отримані експериментально. Зокрема, для  $\text{K}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{PO}_4$   $\varepsilon_{11}^\sigma$  [31],  $d_{14H}$  [32],  $d_{140,12H}$  [33],  $c_{44H}^E$  [34],  $c_{440,12H}^E$  [33]; для  $\text{RbH}_2\text{PO}_4$   $\varepsilon_{11}^\sigma$  [33],  $d_{14H}$  [33],  $c_{44H}^E$  [33]; для  $\text{KH}_2\text{AsO}_4$   $\varepsilon_{11}^\sigma$  [35],  $d_{14}$  [36],  $c_{44}^E$  [36].

Параметри  $\nu_a$  і  $\mu_1$  визначаються з умови найкращого узгодження теорії з експериментом для поперечної діелектричної проникності  $\varepsilon_{11}^\sigma(0, T)$ , причому потрібно прийняти, що величина  $\mu_1(x)$  слабко збільшується зі зростанням температури:

$$\mu_1(x) = \mu_1^0(x) + k_\mu(T - T_c).$$

Параметри  $\psi_4$ ,  $\delta_{a4}$  і  $\delta_{14}$  визначались мірою узгодження результатів теорії і експериментів для п'єзомодулів  $e_{14}$ ,  $d_{14}$ ,  $h_{14}$  і  $g_{14}$ , а також пружної сталі

$c_{44}^E$ . "Затравочні" величини  $\chi_{11}^{\varepsilon 0}$ ,  $e_{14}^0$ ,  $c_{44}^{E0} = 1/s_{44}^{E0}$  визначаються з умови найкращого узгодження теорії з відповідними експериментальними даними у температурних областях, які значно віддалені від температури переходу  $T_c$ .

Отриманий набір оптимальних параметрів на основі "прив'язки" розрахованих поперечних характеристик кристалів  $M(H_{1-x}D_x)_2XO_4$  до відповідних експериментальних даних наведений у табл. 2.

Таблиця 2

**Оптимальні набори параметрів  
для  $KH_2PO_4$  (KDP),  $K(H_{0.12}D_{0.88})_2PO_4$   
(DKDP),  $RbH_2PO_4$  (RDP),  $KH_2AsO_4$  (KDA)**

	KDP	DKDP	RDP	KDA
$\frac{\varepsilon}{k_B}$ (К)	56	88,6	60	35,5
$\frac{w}{k_B}$ (К)	422	815	440	385
$\frac{\nu_3(0)}{k_B}$ (К)	17,91	34,90	29,13	17,43
$\frac{\psi_6}{k_B}$ (К)	-150	-140	-130	-170
$\frac{\delta_{s6}}{k_B}$ (К)	82	50	50	130
$\frac{\delta_{a6}}{k_B}$ (К)	-500	-1000	-500	-500
$\frac{\delta_{16}}{k_B}$ (К)	-400	-400	-300	-500
$\frac{\nu_a}{k_B}$ (К)	7	17	28	20
$\mu_1^0$ (CGSEq·см)	4,27	5,52	3,68	4,85
$k_\mu \cdot 10^{-3}$ (CGSEq·см/K)	5,7	4,2	5,7	6,4
$\chi_{11}^0$	0,8	0,65	1,25	0,7
$\frac{\psi_4}{k_B}$ , (К)	124	188	152	370
$\frac{\delta_{a4}}{k_B}$ , (К)	92	95	80	70
$\frac{\delta_{14}}{k_B}$ , (К)	80	300	5	30
$c_{44}^0 \cdot 10^{-10}$ (дин/см <sup>2</sup> )	13	12,85	10,6	10,8
$e_{14}^0$ (CGSEq/cm <sup>2</sup> )	500	500	2000	2000

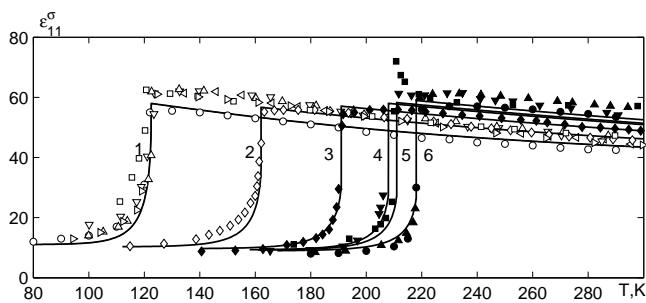


Рис. 2. Температурна залежність поперечної проникності  $K(H_{1-x}D_x)_2PO_4$  за різних  $x$ : 0.0 – 1, □ [37], △ [34], ▽ [18], ▲ [39], ▷ [40], ○ [31]; 0.35 – 2, ◇ [31]; 0.64 – 3, ◆ [31]; 0.84 – 4, ▼ [35]; 0.88 – 5, ■ [33]; 0.98 – 6, ● [31], ▲ [18]. Точки – експериментальні значення, лінії – криві, що розраховані теоретично

Розглянемо тепер отримані результати. На рис. 2 наведено температурні залежності розрахованих поперечних статичних діелектричних проникностей механічно вільних кристалів  $K(H_{1-x}D_x)_2PO_4$  і результати експериментальних вимірювань, які можна поділити на дві групи.

Перша – це роботи [33, 34, 37], в яких в околі  $T_c$  спостерігався  $\lambda$ -подібний характер  $\varepsilon_{11}^\sigma$ , друга – роботи [18, 31, 35, 38, 39, 40], в яких  $\varepsilon_{11}^\sigma$  має куполоподібну поведінку. У [31] виявлено, що поява  $\lambda$ -подібного пика, як проекції аномалії  $\varepsilon_{33}^\sigma$ , зумовлена неточністю орієнтації  $x$ -зрізів, які використовували. У цій роботі проведено детальні вимірювання температурної залежності  $\varepsilon_{11}^\sigma$  для кристалів  $K(H_{1-x}D_x)_2PO_4$  з різними ступенями дейтерування  $x$ . Виявлено дуже слабку залежність значень  $\varepsilon_{11}^\sigma$  від концентрації  $x$ . Величина  $\varepsilon_{11}^{\sigma_{max}}$  зростає від 56,4 за  $x = 0,00$  до 57,4 при  $x = 0,98$ . У точці фазового переходу спостерігається стрибок  $\varepsilon_{11}^\sigma$ , який із зростанням  $x$  також зростає. Значення  $\varepsilon_{11}^\sigma$  [31] за різних  $x$  на 6–10% менші в параелектричній фазі від даних інших робіт.

Ефективні дипольні моменти  $\mu_{1H}^0$  і  $\mu_{1D}^0$  вибрані такими, щоб результати розрахунку  $\varepsilon_{11}^\sigma$  відповідали даним роботи [31]. Отримано добрий кількісний опис температурного ходу  $\varepsilon_{11}^\sigma$  для  $KH_2PO_4$  і  $K(H_{0,02}D_{0,98})_2PO_4$ , які одержані в роботі [31], однак теорія не відтворює куполоподібної поведінки проникності  $\varepsilon_{11}^\sigma$ . Величина стрибка  $\varepsilon_{11}^\sigma$  при  $T = T_c$  дорівнює 3,25 для  $KH_2PO_4$  і 32,8 для  $K(H_{0,02}D_{0,98})_2PO_4$ , що задовільно узгоджуються із, відповідно, 4,0 і 37,1 [18] і 5,2 і 37,5 [31].

На рис. 3 зображені температурні залежності  $\varepsilon_{11}^\sigma$  кристалів  $KH_2PO_4$ ,  $K(H_{0,12}D_{0,88})_2PO_4$ ,  $RbH_2PO_4$  і  $KH_2AsO_4$ .

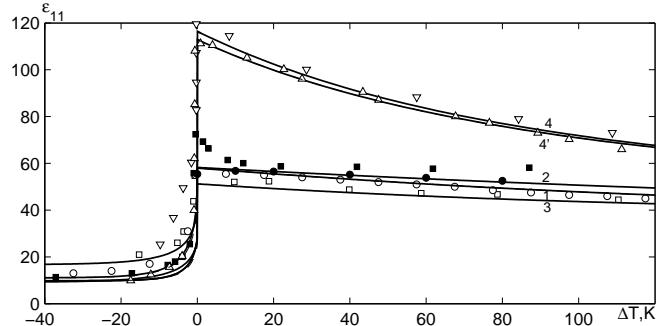


Рис. 3. Температурна залежність поперечної проникності сегнетоелектричних ортофосфатів:  $KH_2PO_4$  – 1, ○ [31];  $K(H_{0,12}D_{0,88})_2PO_4$  – 2, ● [31], ■ [33];  $RbH_2PO_4$  – 3, □ [33];  $KH_2AsO_4$  – 4, △ [35]. Точки – експериментальні, лінії – криві, що розраховані теоретично

Як видно, розраховані в межах запропонованої теорії криві  $\varepsilon_{11}^\sigma$  добре описують дані експериментів, за винятком кристала  $KH_2AsO_4$  в сегнетофазі. Для кристалів  $KH_2PO_4$ ,  $K(H_{0,12}D_{0,88})_2PO_4$ ,  $RbH_2PO_4$  значення поперечних проникостей механічно вільного і затиснутого кристалів практично збігають.

гаються, оскільки значення п'єзомодулів  $e_{14}$  і  $d_{14}$  є малими. У випадку  $\text{KH}_2\text{AsO}_4$  крива 4 відповідає  $\varepsilon_{11}^\sigma$ , а крива 4' –  $\varepsilon_{11}^E$ . У разі ізоморфного заміщення  $\text{K} \rightarrow \text{Rb}$  значення проникності  $\varepsilon_{11}^\sigma$  незначно зменшується в параелектричній фазі і збільшується в сегнетофазі. За заміни  $\text{P} \rightarrow \text{As}$  значно зростає величина  $\varepsilon_{11}^\sigma$  у парафазі і незначно – в сегнетофазі.

Температурні залежності коефіцієнтів п'єзоелектричних деформацій  $d_{14}$  і напруги  $e_{14}$  зображені на рис. 4.

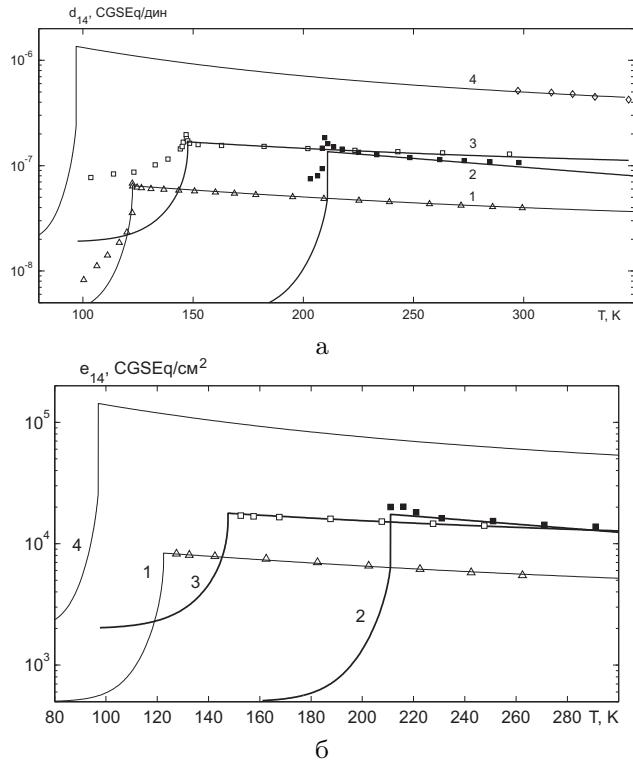


Рис. 4. Температурна залежність коефіцієнта п'єзоелектричної деформації  $d_{14}$  (а) кристалів  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  – 1,  $\Delta$  [32],  $\text{K}(\text{H}_{0,12}\text{D}_{0,88})_2\text{PO}_4$  – 2, ■ [33],  $\text{RbH}_2\text{PO}_4$  – 3, □ [33],  $\text{KH}_2\text{AsO}_4$  – 4,  $\diamond$  [36] і температурна залежність коефіцієнта п'єзоелектричної напруги  $e_{14}$  (б) кристалів  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  – 1,  $\Delta$  –  $d_{14}[32]/s_{44}^E[34]$ ,  $\text{K}(\text{H}_{0,12}\text{D}_{0,88})_2\text{PO}_4$  – 2, ■ –  $d_{14}[33]/s_{44}^E[41]$ ,  $\text{RbH}_2\text{PO}_4$  – 3, □ –  $d_{14}[33]/s_{44}^E[41]$ ,  $\text{KH}_2\text{AsO}_4$  – 4 і температурна залежність константи п'єзоелектричної деформації  $g_{36}$  (б)  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  – 1,  $\triangle$  –  $d_{14}[32]/\chi_{11}^\sigma[34]$ ,  $\circ$  –  $d_{14}[32]/\chi_{11}^\sigma[31]$ ,  $\square$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[33]$ ,  $\blacksquare$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[31]$ ,  $\bullet$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[33]$ ,  $\diamond$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[31]$ ,  $\blacksquare$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[33]$ ,  $\bullet$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[31]$ ,  $\square$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[33]$ ,  $\diamond$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[36]$ . Лінії – криві, що розраховані теоретично

На рис. 5 наведені температурні залежності констант п'єзоелектричних напруги  $h_{14}$  і деформації  $g_{14}$ , які розраховані на основі отриманих співвідношень (3.7) і (3.14). На цих рисунках наведено й експериментально одержано значення  $d_{14}$  за різних температур. Використовуючи дані експериментів для  $d_{14}$ ,  $\varepsilon_{11}^\sigma$  і  $c_{44}^E(s_{44}^E)$ , на основі наведених в роботі термодинамічних співвідношень отримуємо значення  $e_{14}$ ,  $h_{14}$  і  $g_{14}$ , які і зображені на рис. 4, 5. Експериментальні і перевраховані п'єзомодулі кількісно добре описуються на основі мікротеорії, за винятком  $d_{14}$  [33], в сегнетофазі для  $\text{RbH}_2\text{PO}_4$ . Але дані з роботи [33] не корелюють з результатами роботи [32]. П'єзоелектричні характеристики  $d_{14}$ ,  $e_{14}$ ,  $h_{14}$  і  $g_{14}$  не виявляють аномальної температурної залежності.

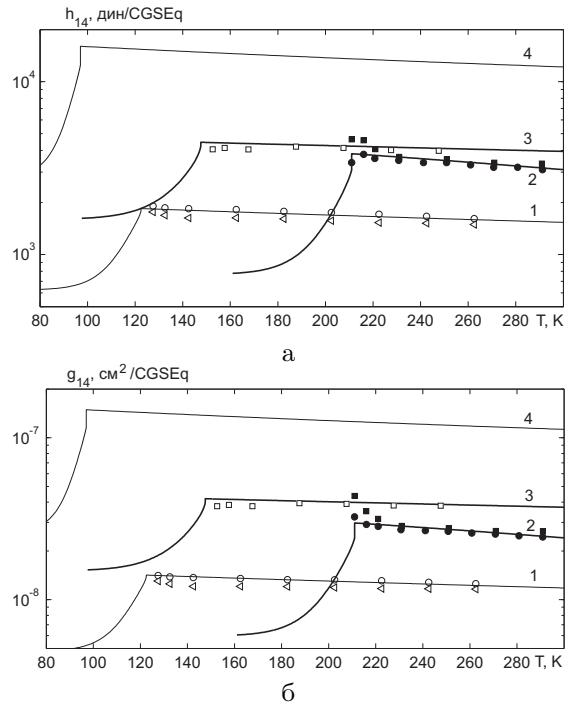


Рис. 5. Температурна залежність константи п'єзоелектричної напруги  $h_{14}$  (а)  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  – 1,  $\triangle$  –  $d_{14}[32]/(s_{44}^E[34]\chi_{11}^\sigma[34])$ ,  $\circ$  –  $d_{14}[32]/(s_{44}^E[34]\chi_{11}^\sigma[31])$ ,  $\square$  –  $d_{14}[32]/(s_{44}^E[41]\chi_{11}^\sigma[33])$ ,  $\blacksquare$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[41]\chi_{11}^\sigma[33])$ ,  $\bullet$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[41]\chi_{11}^\sigma[31])$ ,  $\diamond$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[31])$ ,  $\blacksquare$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[33])$ ;  $\text{K}(\text{H}_{0,12}\text{D}_{0,88})_2\text{PO}_4$  – 2,  $\square$  –  $d_{14}[32]/(s_{44}^E[41]\chi_{11}^\sigma[33])$ ,  $\blacksquare$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[41]\chi_{11}^\sigma[33])$ ,  $\bullet$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[31])$ ,  $\blacksquare$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[33])$ ;  $\text{RbH}_2\text{PO}_4$  – 3,  $\square$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[41]\chi_{11}^\sigma[33])$ ,  $\blacksquare$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[31])$ ,  $\bullet$  –  $d_{14}[33]/(s_{44}^E[33])$ ;  $\text{KH}_2\text{AsO}_4$  – 4 і температурна залежність константи п'єзоелектричної деформації  $g_{36}$  (б)  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  – 1,  $\triangle$  –  $d_{14}[32]/\chi_{11}^\sigma[34]$ ,  $\circ$  –  $d_{14}[32]/\chi_{11}^\sigma[31]$ ,  $\square$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[33]$ ,  $\blacksquare$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[31]$ ,  $\bullet$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[33]$ ,  $\diamond$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[31]$ ,  $\blacksquare$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[33]$ ,  $\bullet$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[31]$ ,  $\square$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[33]$ ,  $\diamond$  –  $d_{14}[33]/\chi_{11}^\sigma[36]$ . Лінії – криві, що розраховані теоретично

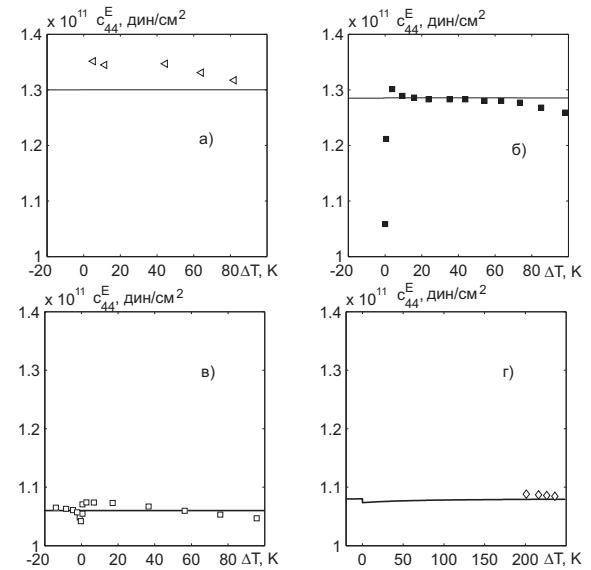


Рис. 6. Температурна залежність пружності сталої  $c_{44}^E$  кристалів  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  – а),  $\triangle$  – [34],  $\text{K}(\text{H}_{0,12}\text{D}_{0,88})_2\text{PO}_4$  – б),  $\blacksquare$  – [41];  $\text{RbH}_2\text{PO}_4$  – в),  $\square$  – [41],  $\text{KH}_2\text{AsO}_4$  – г),  $\diamond$  – [36]. Лінії – криві, що розраховані теоретично

Не виявлено аномальних температурних залежностей для розрахованих температурних залежностей пружних сталих  $c_{44}^E$  (рис. 6) для кристалів, які досліджуються. Результати розрахунків узгоджуються з даними експериментів. Внаслідок того, що п'єзомодулі  $e_{14}$  і  $h_{14}$  є малими, то  $c_{44}^E = c_{44}^P$ .

## V. Висновки

У цій роботі розглянуто модифіковану протонну модель, у межах якої можна вивчати впливи механічної напруги  $\sigma_4$  та електричного поля  $E_1$  з врахуванням спонтанної деформації  $\varepsilon_6$  на поперечні п'єзоелектричні, статичні діелектричні та пружні властивості сегнетоелектриків типу  $KD_2PO_4$ . У межах

цієї моделі, використовуючи наближення чотирічленкового кластера, отримані вирази для коефіцієнтів п'єзоелектричної напруги  $e_{14}$ , статичних поперечних діелектричних сприйнятливостей при сталій деформації  $\chi_{11}^\varepsilon$ . У роботі розраховано пружні сталі за постійного поля  $c_{44}^E$ . Запропонована модель дала можливість за належного вибору параметрів теорії адекватно кількісно описати експериментальні дані для температурних залежностей діелектричних, п'єзоелектричних та пружних характеристик, які пов'язані з деформацією  $\varepsilon_4$  та полем  $E_1$ , сегнетоелектриків  $M(H_{1-x}D_x)_2XO_4$ . Порівняння отриманих наявні результатів для діелектричних, п'єзоелектричних і пружних характеристик для  $KH_2PO_4$  з результатами роботи [13] свідчить про те, що тунелювання практично не впливає на їхню поведінку.

## Література

- [1] Вакс В.Г. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков. – М.: Наука, 1973. – 327 с.
- [2] Левицький Р.Р., Кориневский Н.А., Стасюк И.В. Теория протонного упорядочения в сегнето- и антисегнетоэлектриках типа ортофосфатов // Укр. физ. журн. – 1974. – Т. 19, №8. – С. 1289–1297.
- [3] Блинц Р., Жекш Б. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Динамика решетки. – М.: Мир, 1975. – 398 с.
- [4] Levitskii R.R., Zacheck I.R., Vdovych A.S., Sorokov S.I. Thermodynamics and dynamical properties of the  $KH_2PO_4$  type ferroelectric compounds. A unified model // Condens. Matter Phys. – 2009. – Vol. 12, No 1. – P. 75–119.
- [5] Yomosa Sh., Nagamiya T. The phase transition and the piezoelectric effect of  $KH_2PO_4$ . // Progr. Theor. Phys. – 1949. – V. 4, № 3. – P. 263–274.
- [6] Slater J.C. Theory of the transition in  $KH_2PO_4$ . // J. Chem. Phys. – 1941. – V. 9, № 1. – P. 16–33.
- [7] Стасюк И.В., Билемецкий И.Н. Влияние всестороннего и одноосного давления на сегнетоэлектрический фазовый переход в кристаллах типа  $KH_2PO_4$  // Изв. АН СССР, сер. физ. – 1983. – Т. 47. – С. 705.
- [8] Стасюк И.В., Билемецкий И.Н., Стятар О.Н. Индуцированные внешним давлением фазовые переходы в кристаллах  $KD_2PO_4$ . // УФЖ. – 1986. – Т. 31, № 4. – С. 567–571.
- [9] Stasyuk I.V., Levitskii R.R., Zacheck I.R., Moina A.P. The  $KD_2PO_4$  ferroelectrics in external fields conjugate to the order parameter: Shear stress  $\sigma_6$ . // Phys. Rev. B. – 2000. – V. 62, №. 10. – P. 6198–6207.
- [10] Levitsky R.R., Zacheck I.R., Vdovych A.S., Moina A.P. Longitudinal dielectric, piezoelectric, elastic, and thermal characteristics of the  $KH_2PO_4$  type ferroelectrics // J. Phys. Study. – 2010. – Vol. 14, No 1. – P. 1701(17 p.)
- [11] Левицький Р.Р., Лісний Б.М., Теорія п'єзоелектричних, пружних та діелектричних властивостей кристалів сім'ї  $KH_2PO_4$  при деформації  $u_6$ . Фазовий перехід та п'єзоэффект у кристалі  $KH_2PO_4$  // Журн. фіз. досліджень. – 2003, Т. 7, №4. – С. 431–445.
- [12] Levitskii R.R., Lisnii B.M. Theory of related to shear strain  $u_6$  physical properties of ferroelectrics and anti-ferroelectrics of the  $KH_2PO_4$  family // phys. stat. sol. (b). – 2004. – Vol.241, №6. – P.1350–1368.
- [13] Lisnii B.M., Levitskii R.R. Theory of physical properties of ferro- and antiferroelectrics of the  $KH_2PO_4$  family related to strains  $u_4$  and  $u_5$  // Ukr. J. Phys. – 2004. – V. 49, №7. – P.701–709.
- [14] Стасюк И.В., Камінська Н.М. Теорія спонтанної поляризації і деформації сегнетоелектриків типу  $KH_2PO_4$ . // УФЖ. – 1974. – Т. 19, Вип. 2. – С. 237–252.
- [15] S. Havlin, E. Litov, E.A. Uehling. Transverse Susceptibility in  $KH_2PO_4$ -type crystals // Phys. Rev. B. – 1974. – V. 9, №3. – P. 1024–1028.
- [16] Y. Takagi, T. Shigenavi. Transverse Susceptibility and E-Mode Raman Spenctra of a  $KH_2PO_4$  Crystal // J. of Phys. Soc. Japan. – 1975. – V. 39, №2. – P. 440–447.
- [17] Havlin S., Litov E., Sompolinsky H. The transverse dielectric properties of  $KH_2PO_4$  // Phys. Lett. – 1975. – Vol. 51A, №1. – P. 33–35.
- [18] Havlin S., Litov E., Sompolinsky H. Unified model for the transverse electric susceptibility in  $KH_2PO_4$  and  $NH_4H_2PO_4$  - type crystals // Phys. Rev. B. – 1976. – Vol. 14, №3. – P. 1297–1302.
- [19] Halvin S. Longitudinal and transverse dielectric constant of KDP-type ferro- and antiferroelectrics // Ferroelectrics. – 1987. – Vol. 71. – P. 183–223.
- [20] D.C. Rapport, S. Havlin. Longitudinal and transverse properties of  $KD_2PO_4$  - A monte carlo study // Solid Stat. Comm. – 1979. – V. 29. – P. 611–614.
- [21] Sompolinsky H., Havlin S. Effect of short-range interaction on the transverse dynamics of  $KD_2PO_4$  // Phys. Rev. B. – 1977. – Vol.16, №7. – P. 3223–3229.
- [22] Левицький Р.Р., Зачек І.Р., Миц Е.В. Поперечная релаксация в сегнетоэлектриках типа  $K(H_{1-x}D_x)PO_4$ . – К., 1987. – 48 с. (Препр. / АН УССР. Ин-т теор. физ.; ИТФ-87-115Р).

- [23] Stasyuk I.V., Levitskii R.R., Korinevskii N.A. Collective vibrations of protons in compounds of  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ -type. The cluster approximation // Phys. Stat. Sol. (b). – 1979. – Vol. 91, №2. – P. 541–550.
- [24] Levitsky R.R., Zacheck I.R., Moina A.P., Vdovych A.S. Longitudinal relaxation of mechanically free  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  type crystals. Piezoelectric resonance and sound attenuation // Condens. Matter Phys. – 2008. – Vol. 11, No 3(55). – P. 555–570.
- [25] Левицький Р.Р., Зачек І.Р., Вдович А.С. Поперечна релаксація в сегнетоелектриках з водневими зв'язками сім'ї  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, № 2. – С. 377–388.
- [26] Левицький Р.Р., Зачек І.Р., Вдович А.С. Повздовжні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні, динамічні та теплові властивості сегнетоелектриків типу  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  // Препринт ICMP-06-08U. – Львів, 2006. – 116 с.
- [27] Левицький Р.Р., Зачек І.Р., Вдович А.С. Поперечні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та динамічні властивості сегнетоелектриків типу  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ . – Львів, 2007. – 80 с. (Препр. / НАН України. Ін-т фіз. конденс. систем; ICMP-07-24U).
- [28] Blinc R., Svetina S. Cluster approximation for order-disorder-type hydrogen-bounded ferroelectrics II. Application to  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  // Phys. Rev. – 1966. – Vol. 147, №2. – P. 430–438.
- [29] Levitsky R.R., Korinevsky N.A., Stasjuk I.V. Distribution function and thermodynamical properties of  $\text{KD}_2\text{PO}_4$ , and  $\text{ND}_4\text{D}_2\text{PO}_4$  type crystals // Phys. Stat. Sol. b. – 1978. – Vol. 88, №1. – P. 51–63.
- [30] Левицький Р.Р., Моїна А.П., Лісний Б.М. Вплив повздовжнього електричного поля на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків сім'ї  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  // Препринт ICMP-00-12U. – Львів, 2000. – 36 с.
- [31] Волкова Е.Н. Физические свойства сегнетоэлектрических твердых растворов  $\text{K}(\text{D}_x\text{H}_{1-x})_2\text{PO}_4$  // Дисс. ... канд. физ.-матем. наук. – М., 1991. – С. 152.
- [32] Иона Ф., Ширанэ Д. Сегнетоэлектрические кристаллы. – М.: Мир, 1965. – 555 с.
- [33] Шувалов Л.А., Желудев И.С., Мнацаканян А.В., Лупудов Ц.Ж., Фиала И. Сегнетоэлектрические аномалии диэлектрических и пьезоэлектрических свойств кристаллов  $\text{RbH}_2\text{PO}_4$  и  $\text{KD}_2\text{PO}_4$  // Изв. АН СССР, сер. физ. – 1967. – Т. 31, №11. – С. 1919–1922.
- [34] Мэзон У. Пьезоэлектрические кристаллы и их применение в ультраакустике. – М.: ИЛ, 1952. – 447 с.
- [35] F. Gilletta, M. Chabin. Longitudinal and transverse dielectric properties of KDP Type Crystals // Phys. stat. sol. (b). – 1980. – V. 100. – P. K77-K82.
- [36] Adhav.R.S. // J.Appl.Phys. – 1968. – V.39. – P.4095.
- [37] Кенциг В. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. – М.: ИЛ, 1960. – 234 с.
- [38] Струков Б.А., Баддура А., Коцник В.А., Величко И.А. Электрические и тепловые свойства смешанных сегнетоэлектрических кристаллов  $\text{KH}_{2(1-x)}\text{D}_{2x}\text{PO}_4$  // Физ.тврдого тела. – 1972. – Т. 14, №4. – С. 1034–1039.
- [39] Deguchi K., Nakamura E. Deviation from the Curie-Weiss law in  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  // J.Phys.Soc.Japan. – 1980. – V.49, №5. – P. 1887–1891.
- [40] Kaminov I.P. Microwave dielectric properties of  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ ,  $\text{KH}_2\text{AsO}_4$  and partially deuterated  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  // Phys. Rev. – 1965, Vol. 138, №5A. – P. 1539–1543.
- [41] Shuvalov L.A., Mnatsakanian A.V. The elastic properties of  $\text{KD}_2\text{PO}_4$  crystals over a wide temperature range. // Sov. Phys. Crystall. – 1966. – Vol. 11, №2. – P. 210–212.

## ПОПЕРЕЧНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И УПРУГИЕ СВОЙСТВА СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ ТИПА $\text{KH}_2\text{PO}_4$

Р.Р. Левицкий<sup>a</sup>, А.С. Вдович<sup>a</sup>, И.Р. Зачек<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Институт физики конденсированных систем НАН Украины  
ул. Свеницкого, 1, 79011, Львов, Украина

<sup>b</sup> Национальный университет “Львовская политехника”,  
ул. С. Бандери, 12, Львов, 79013, Украина

В рамках модифицированной модели протонного упорядочения с учетом линейных по деформациям  $\varepsilon_6$  і  $\varepsilon_4$  вкладов в энергию протонной системы в приближении четырехчастичного кластера получен термодинамический потенциал и на его основе рассчитаны поперечные статические диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики сегнетоэлектриков типа  $\text{KD}_2\text{PO}_4$ . Проведен тщательный численный анализ полученных результатов, найдены оптимальные наборы микропараметров, которые обеспечивают хорошее количественное описание соответствующих экспериментальных данных для сегнетоэлектриков  $M(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$  ( $M = \text{K}, \text{Rb}$ ,  $\text{X} = \text{P}, \text{As}$ ).

**Ключевые слова:** сегнетоэлектрики, диэлектрическая проницаемость, пьезоэлектрические константы.

**PACS:** 77.84.-s, 77.22.-d, 77.80.-e, 77.80.Bh, 77.65.Bn

**УДК:** 526.7

## TRANSVERSE STATIC DIELECTRIC, PIEZOELECTRIC AND ELASTIC PROPERTIES OF $\text{KH}_2\text{PO}_4$ TYPE FERROELECTRICS

R.R. Levitsky<sup>a</sup>, A.S. Vdovych<sup>a</sup>, I.R. Zacheck<sup>b</sup>

<sup>a</sup> National University "Lvivska Politechnika  
Institute of Applied Mathematics and Fundamental Sciences,  
12 S. Bandery Str., Lviv, UA-79013, Ukraine  
<sup>b</sup> National University "Lvivska Politechnika"  
12 S. Bandera Str., 79013, Lviv, Ukraine

Within the modified proton ordering model with taking into account linear in strain  $\varepsilon_6$  and  $\varepsilon_4$  contributions to the energy of proton system within the four-particle cluster approximation we have obtained thermodynamic potential and on the basis of it the transverse dielectric, piezoelectric and elastic characteristics of the  $\text{KD}_2\text{PO}_4$  type ferroelectrics are calculated. Numerical analysis of the obtained results is performed, and the set of the theory parameters providing the best fit to the available experimental data for  $\text{M}(\text{H}_{1-x}\text{D}_x)_2\text{XO}_4$  ( $\text{M} = \text{K}, \text{Rb}$ ,  $\text{X} = \text{P}, \text{As}$ ) ferroelectrics is found.

**Key words:** ferroelectrics, dielectric permittivity, piezoelectric constants.

**PACS:** 77.84.-s, 77.22.-d, 77.80.-e, 77.80.Bh, 77.65.Bn

**УДК:** 526.7